

顕微反射分光膜厚計

- ・ **非接触・非破壊・顕微で測定時間1秒!**
- ・ ターゲット膜の絶対反射率を測定し
膜厚と光学定数を精度良く計測!

製品特徴

- 顕微分光で**高精度な絶対反射率測定**(多層膜厚、光学定数)
- **1ポイント1秒以内**の高速測定
- 顕微下で**広い測定波長範囲**を実現する光学系(紫外～近赤外)

	反射分光	X線透過	I-R透過	触針式	変位式	断面SEM測
薄膜対応	◎可能	×	×	△	△	◎
測定時間	◎高速	◎	◎	×	◎	×
非接触性	◎非接触	◎	◎	×	◎	×
前処理の必要性	◎なし	◎	◎	◎	◎	×
検量線の必要性	◎なし	×あり	×あり	◎	◎	◎
多層膜対応	◎可能	△	△	×	×	◎
光学定数解析	◎可能	×	×	×	×	×



仕様

- メーカー…大塚電子(株)
- 品番…OPTM-F1
- 測定波長…230-800nm
- スポット径…10 μ m
- 測定時間…1秒/1ポイント
- 測定膜厚…1nm~35 μ m
- 膜厚精度…0.1nm

光電子分光装置

- ・ **非接触、非破壊**で仕事関数、イオン化ポテンシャルを測定。
- ・ 半導体やリードフレームの**表面酸化状態**を測定。
- ・ サンプル表面の薄膜・**分子レベルの膜状汚染**を検知。

製品特徴

- 大気中で測定を行うため、**最大50mm角**を測定できます。
- 光電子のため**分子レベルの表面被膜の情報**を検知できます。
- 仕事関数、イオン化ポテンシャルを**5分**で測定できます。



仕様

- メーカー…理研計器(株)
- 品番…AC-2
- 検知範囲…3.4~6.2eV
- 繰り返し精度…0.02eV
- 紫外線ランプ…重水素ランプ
- スポットサイズ…2~4mm
- サンプルサイズ…50mm角

分光蛍光光度計

- ・ 励起光の吸収特性の測定。
- ・ 蛍光の発光特性、発光色の測定。
- ・ りん光強度の時間変化、りん光寿命の測定。



製品特徴

- 最高S/N 300以上
- 検出感度を自動的に調整するオートゲイン機能搭載
- 自動高次光カットフィルタ標準搭載
- 1 msecのりん光寿命測定可能

仕様

- メーカー…日本分光(株)
- 品番…FP-8500DS
- 測定波長範囲…200~850nm
- 分解能…1.0nm
- 光源…150W Xeランプ
- 波長移動…60,000nm/min
- 3次元測定時間…5min以内

紫外可視近赤外分光光度計

- ・ 透過・吸収波長の測定。
- ・ 絶対反射率波長の測定。
- ・ バンドギャップの測定。
- ・ 拡散反射、拡散透過の測定。



製品特徴

- 測定波長範囲全域に渡り、広いダイナミックレンジを実現
- シングルモノクロメータの高効率な明るい光学系

仕様

- メーカー…日本分光(株)
- 品番…V-750DS
- 測定波長範囲…190~900nm
- 波長精度…0.2nm
- 光源…重水素、ハロゲンランプ
- 検出器…光電子増倍管